

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕШЕНИЙ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ЗАДАЧ ХЕЛЕ — ШОУ С ПОМОЩЬЮ ЧИСЛЕННОЙ ФИЛЬТРАЦИИ

В. П. Житников, О. Р. Зиннатуллина, Г. И. Федорова

Уфимский государственный авиационный технический университет, Уфа

Аннотация. Задача на каждом временном шаге сводится к решению трех краевых задач для определения аналитических функций комплексного переменного: конформного отображения области параметрического переменного на физическую плоскость, задачи Дирихле для определения напряженности электрического поля и задачи Римана–Гильберта для вычисления частных производных по времени координат точек межэлектродного пространства. Производится аппроксимация сплайн-функциями, описываются алгоритмы общего решения нестационарных задач, отличающиеся от известных своей точностью и устойчивостью. Представляются результаты численного решения.

Ключевые слова: уравнение Лапласа, численно-аналитический метод, численная фильтрация

1. Введение

Рассматриваются задачи по решению уравнения Лапласа для потенциала Φ внутри некоторой области, на границах которой выполняется условие постоянства Φ , причем свободные границы могут быть подвижны (скорость движения пропорциональна градиенту Φ), либо быть стационарными, либо сохранять геометрическое подобие межэлектродного пространства (автомодельные решения). Такие задачи принято называть задачами Хеле-Шоу со свободными границами. Решения этих задач могут



Рис. 1. Схема межэлектродного пространства

интерпретироваться как процессы растворения металлов при электрохимической обработке (ЭХО).

2. Постановка задачи

Рассмотрим задачу обработки точечным электродом-инструментом (ЭИ). Сечение межэлектродного пространства (МЭП) показано на Рис. 1. Здесь *ADB* — граница растворяемого материала, точка *C* — точечный ЭИ, движущийся со скоростью V_t к обрабатываемой поверхности.

Потенциал Φ осесимметричного поля выражается через функцию комплексного переменного, аналитическую в области Z, форма границ которой совпадает с формой границ межэлектродного пространства в меридиональном сечении осесимметричного поля, с помощью формул (преобразований Г. Н. Положего [1]):

$$\Phi(X_0, Y_0) = -\frac{1}{\pi} \operatorname{Im} \int_{-\infty}^{Z_0} f(Z) \frac{dZ}{\sqrt{(Z - Z_0)(Z - \overline{Z}_0)}},$$
(1)

где $Z_0 = X_0 + iY_0, \overline{Z}_0 = X_0 - iY_0.$

Потенциал осесимметричного течения получается путем интегрального преобразования (1), примененного к функции f(Z) = dW/dZ [2].

Продольная и радиальная составляющие напряженности определяются дифференцированием (1).

Отобразим конформно области, соответствующие МЭП на плоскостях Z и W на полосу χ . При этом определение функции W(Z), аналитической на области МЭП, можно решать в параметрическом виде. Границы области МЭП определяются через частную производную $\frac{\partial Z}{\partial t}(\chi, t)$ численным методом путем дискретизации времени.

Таким образом, на каждом временном шаге решаются три краевые задачи.

Найти три аналитические внутри полосы χ функции $W(\chi, t), Z(\chi, t)$ и $\frac{\partial Z}{\partial t}(\chi, t)$, удовлетворяющие определенным краевым условиям.

Краевым условием для определения функции $W(\chi, t)$ является условие эквипотенциальности анода.

Краевым условием для определения функции $Z(\chi, t)$ является равенство мнимой (или действительной) части $Z(\chi, t)$ на границе полосы $\chi = \sigma \ (-\infty < \sigma < \infty)$, известной при каждом фиксированном t функции $g_1(\sigma, t)$.

Краевые условия для функции $\partial Z/\partial t(\chi, t)$ на границах МЭП определяются законом Фарадея. В безразмерных переменных краевое условие для определения производной $\partial z/\partial \tau(\chi, \tau)$ примет вид:

$$\frac{\partial x}{\partial \tau} \frac{\partial y}{\partial \sigma} - \frac{\partial y}{\partial \tau} \frac{\partial x}{\partial \sigma} = \frac{1}{y} \frac{d\psi}{d\sigma}.$$
(2)

3. Метод решения задачи

Задача конформного отображения решается следующим образом. В качестве области изменения параметрического переменного $\chi = \sigma + iv$ удобно выбрать полосу ширины 1/2, так что нижняя граница соответствует обрабатываемой поверхности, верхняя — разрезу A'CB'.

Функция, отображающая плоскость
 χ на физическую, ищется в виде суммы

$$z(\chi) = z_0(\chi) + z_\Delta(\chi), \quad z_0(\chi) = ig \operatorname{sh} \pi \chi.$$

Функция $z_{\Delta}(\chi)$ получается следующим образом. Будем искать решение на границе $\chi = \sigma$ в узловых точках $\sigma_m(m = 0, ..., n)$. Искомыми будут значения Re $z_{\Delta}(\sigma_m) = x_m$. При $\sigma = \sigma_n$ примем Re $z_{\Delta}(\sigma_n) = 0$, поскольку $z_{\Delta}(\sigma)$ быстро (как экспонента) убывает при $\sigma \to \infty$. Значения Re $z_{\Delta}(\sigma)$ в промежуточных между узловыми точках найдем с помощью кубического сплайна $P(\sigma)$, имеющего две непрерывные производные.

Для восстановления функции $z_{\Delta}(\chi)$ используем формулу Шварца с учетом того, что $z_{\Delta}(\chi)$ аналитическая функция, имеющая, как и $z_0(\chi)$ чисто действительные значения на прямой $\text{Im}\chi = 1/2$.

Осесимметричная задача решается путем сведения ее к вспомогательной плоской задаче. Для ее решения область, соответствующая МЭП на плоскости комплексного потенциала, конформно отображается на плоскость параметрического переменного χ . Закон изменения потенциала на границах вспомогательной плоской задачи определяется краевым условием (1), то есть условием эквипотенциальности границы в осесимметричной задаче. Решение задачи можно искать в виде суммы

$$\varphi(x,y) = -\frac{1}{4\pi} \frac{1}{\sqrt{(x+l)^2 + y^2}} - \frac{1}{\pi} \operatorname{Im} \int_{0}^{\sigma_0} \frac{\partial w}{\partial \sigma}(\sigma) \frac{d\sigma}{\sqrt{(z-z_0)(z-\overline{z}_0)}},$$
(3)

где $\varphi_0(x,y)$ — потенциал точечного источника, расположенного на расстоянии *l* слева от начала координат.

Будем искать решение в виде функции $f_1(\chi) = \frac{\partial^2 w}{\partial z \partial \nu}(\chi)$. Искомыми параметрами будут значения действительной части функции Re $f_1(\sigma_m) = f_m$ в узловых точках σ_m $(m = 1, \dots, n)$. Значения Re $f_1(\sigma)$ в промежуточных между узловыми точках найдем с помощью кубического сплайна. Для восстановления функции $f_1(\chi)$ используем формулу Шварца. Условие эквипотенциальности обрабатываемой поверхности при решении методом коллокаций приводит к системе уравнений (равенству нулю тангенциальной составляющей напряженности).

Нестационарная задача решается методом дискретных шагов по времени Δ_{τ} [3]. При этом на каждом временном шаге τ_i решаются задачи конформного отображения полосы параметрической плоскости χ на физическую плоскость z и определения составляющих напряженности $\frac{\partial \varphi}{\partial x}$, $\frac{\partial \varphi}{\partial y}$

После определения $\frac{\partial \varphi}{\partial x}, \frac{\partial \varphi}{\partial u}$ остается решить третью краевую задачу: найти частную производную $\overset{\circ}{\partial} z_{\Delta} \over \partial \tau}(\chi,\tau_j) = \frac{\partial x_{\Delta}}{\partial \tau}(\chi,\tau_j) + i \frac{\partial y_{\Delta}}{\partial \tau}(\chi,\tau_j)$ как аналитическую функцию комплексного параметра χ , удовлетворяющую краевому условию (2).

Для вычисления производной $\frac{\partial z_{\Delta}}{\partial \tau}(\chi, \tau_j)$ применяется способ, аналогичный применяемому для определения конформного отображения $z_{\Delta}(\chi, \tau_i).$

После решения системы линейных алгебраических уравнений и опре-

деления частных производных $\frac{\partial x_{\Delta}}{\partial \tau}$ производится шаг по времени по методу предиктор–корректор второго порядка точности.

Далее процесс повторяется.

4. Определение параметров переходных процессов

Исследованию подлежит закон установления автомодельной, стационарной и финальной форм при увеличении безразмерного времени.

Порядок расчета следующий. Отдельно рассчитываются автомодельная и стационарная формы. Значения параметров уточняются путем численной фильтрации результатов расчетов, полученных при различном числе точек коллокаций [4]. В результате фильтрации точность повышалась на 2-4 значащих цифры. Затем решалась нестационарная задача, при этом значения параметров на каждом временном шаге также подвергались численной фильтрации. Далее уточненные параметры формы (линейные размеры, кривизна обрабатываемой поверхности) сравнивались с предельными, и исследовалась зависимость разностей от времени. Поскольку зависимости оказались близкими к экспоненциальным, определялись декременты. Так как каждое действие: вычисление кривизны дифференцированием зависимостей линейных размеров, вычисление разностей с последующим логарифмированием, определение декремента приводит каждый раз к потере примерно половины точных значащих цифр, уточнение исходных результатов оказалось решающим при формулировке вывода.

На Рис. 2 дана зависимость десятичного логарифма разности $-\lg \left| \frac{S(\tau) - S^*}{S^*} \right|$ от безразмерного времени τ , где S — зазор; S^* — величина стационарного зазора. Видно, что эта зависимость близка к линейной, то есть закон установления близок к экспоненциальному. Точность приближения к предельному значению ограничена 10-ю знаками, которые получаются при экстраполяции данных нестационарной задачи, и объясняется ограниченностью вычислительных ресурсов при ее решении. Для оценки параметров линейной зависимости применялся метод наименыших квадратов. В результате получены следующие значения: постоянная времени (угловой коэффициент логарифмической зависимости) $k_{\tau} = 2.09$; аддитивная постоянная a = -1.92; среднеквадратичная погрешность аппроксимации $\sigma_a = 0.01$.

При исследовании зависимости кривизны обрабатываемой поверхности в точке, ближайшей к ЭИ, от безразмерного времени τ (установле-



Рис. 2. Установление стационарного зазора при бесконечно удаленном начальном положении ЭИ: зависимость десятичного логарифма разности от времени

ния стационарного значения кривизны) получены параметры: $k_{\tau} = 2.09$; a = -2.16; $\sigma_a = 0.005$. Аналогичные зависимости получены для нулевого начального зазора. Получены следующие значения: $k_{\tau} = 2.08$; a = -0.68; $\sigma_a = 0.01$. Таким же способом получены параметры зависимости максимальной кривизны от времени для бесконечно удаленного ЭИ (установление значения кривизны финальной формы): $k_{\tau} = 2.08$; a = -2.88; $\sigma_a = 0.05$.

5. Заключение

В результате исследований временных характеристик процессов установления параметров форм к стационарным и финальным значениям во всем диапазоне значений начального зазора между ЭИ и исходной обрабатываемой поверхностью показало, что постоянная времени k_{τ} одинакова во всех случаях (≈ 2.1) в пределах достигнутой точности.

Список литературы

 Положий Г. Н. Обобщение теории аналитических функций комплексного переменного. Киев: Киев. ун-т, 1965. 442 с.

- [2] Житников В. П. Решение плоских и осесимметричных задач с помощью методов теории функции комплексного переменного. Уфа: УГА-ТУ, 1994. 106 с.
- [3] Zhitnikov V. P., Fedorova G. I., Zinnatullina O. R., Simulation of nonstationary processes of electrochemical machining // Journal of Materials Processing Tech. 2004. V. 149/1-3. Elsevier. P. 398–403.
- [4] Zhitnikov V. P., Zinnatullina O. R., Sherykhalina N. M., Oshmarin A. A. Numerical filtration as methodv of précisingv of computing results and error estimation // Proceedings of the 8-th Workshop on Computer Science and Information Technologies CSIT'2006. Karlsruhe, Germany, 2006. V. 1. P. 134–137.